

Радиационные характеристики γ -источников из Sm¹⁴⁵ и обогащенного Se⁷⁵

C. B. Румянцев, B. A. Добромуслов, A. С. Штань, E. E. Кулиш

Для контроля и регулирования разнообразных технологических процессов, контроля качества изделий и т. д. большой интерес представляют источники с низкой энергией γ -квантов и максимально возможной удельной активностью.

В работе [1] показано, что спектр излучения Sm¹⁴⁵ состоит из характеристического рентгеновского излучения с энергией 39 кэв (K_{α} -линия прометия) и собственного γ -излучения Sm¹⁴⁵ с энергией 61 кэв.

Спектр γ -излучения Se⁷⁵ состоит из 10 линий различной интенсивности с энергией излучения в пределах 0,066—0,405 Мэв, причем наибольшей интенсивностью обладают линии с энергией 0,269 и 0,138 Мэв. Оказалось, что использование источников излучения с малой энергией γ -квантов (Sm¹⁴⁵) повысит по сравнению с Ti¹⁷⁰ и Eu¹⁵⁵ [1] эффективность контроля качества сварки, пайки, литья и других технологических процессов, применяемых при изготовлении тонкостенных изделий, а повышение удельной активности источников из Se⁷⁵ за счет обогащения исходного сырья значительно улучшит их радиационные характеристики по сравнению с источниками из необогащенного Se⁷⁵.

Исследовали спектральный состав излучения, испускаемого указанными источниками. Источник из Sm¹⁴⁵ был получен нейтронным облучением потоком $7 \cdot 10^{19}$ нейтр./см² 0,01 г Sm₂O₃, обогащенной Sm¹⁴⁵. Ниже приведены паспортные данные на источник:

Активность (в момент проведения эксперимента)	0,3 мг-экв Ra
Внешние размеры источника:	
диаметр	4 мм
высота	5 мм
Размеры активной части:	
диаметр	2 мм
высота	2 мм
Изотопный состав материала	92,6% Sm ¹⁴⁴ ; 4,3% Sm ¹⁴⁷ ; 0,8% Sm ¹⁴⁸ ; 0,7% Sm ¹⁴⁹ ; 0,3% Sm ¹⁵⁰ ; 0,8% Sm ¹⁵² ; 0,5% Sm ¹⁵⁴
Химические примеси	Не более 0,01% железа; не более 0,005% меди

Спектральный состав излучения источника из Sm¹⁴⁵ измеряли на сцинтилляционном γ -спектрометре, состоящем из кристалла NaJ(Tl) высотой 8 мм и диаметром 29 мм, ФЭУ-11 и стоканального амплитудного анализатора типа АИ-100. Разрешающая способность спектрометра составляла 10% на линии 660 кэв Cs¹³⁷.

* Спектры γ -источников из Sm¹⁴⁵ и Se⁷⁵ измеряли в лаборатории ядерной спектроскопии Научно-исследовательского института ядерной физики при МГУ под руководством В. С. Шпинеля.

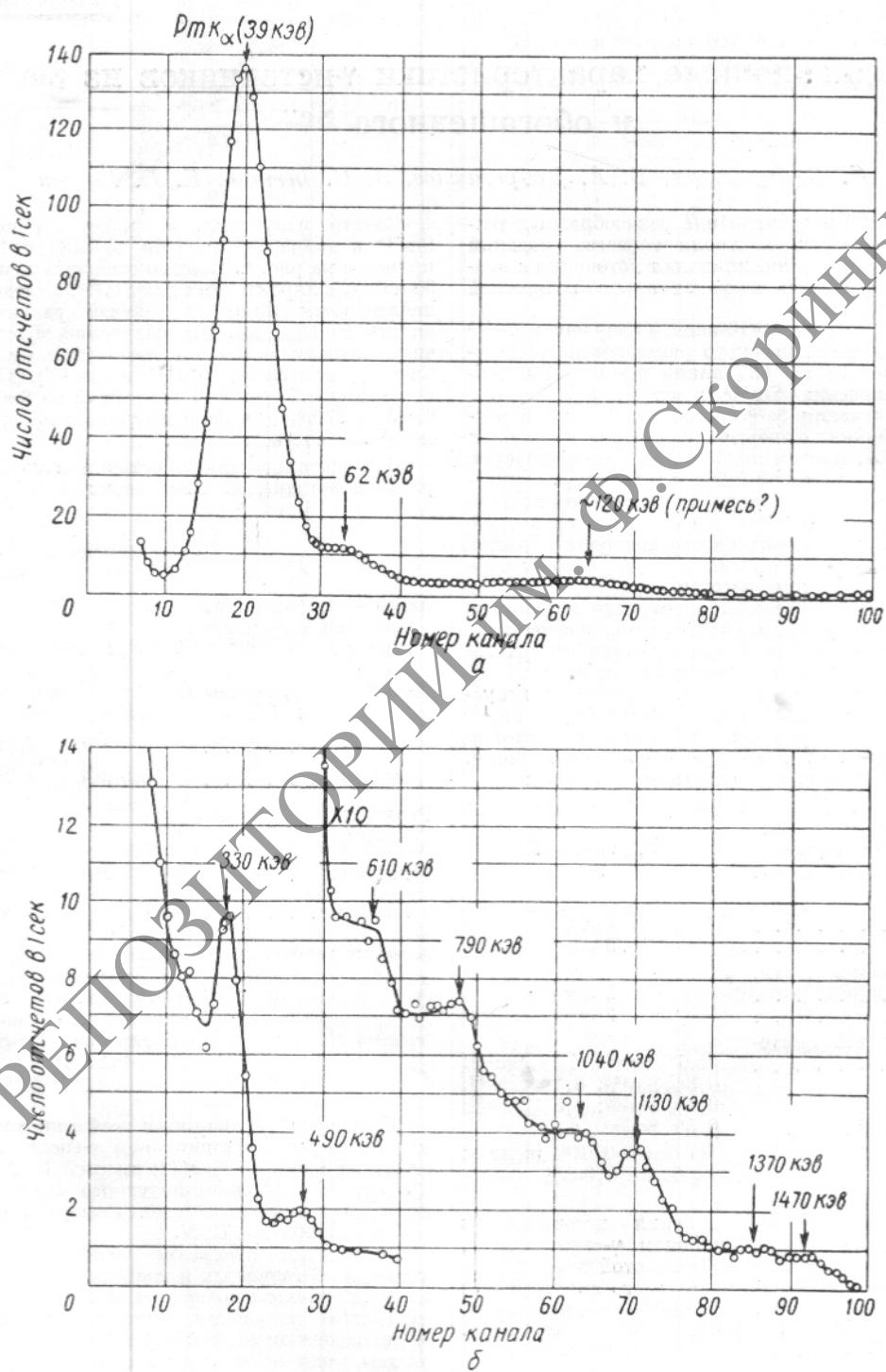
Спектр излучения, испускаемого источником из Sm¹⁴⁵ в диапазоне энергий 15—180 и 180—1500 кэв, приведен на рис. 1. Помимо основных линий с энергией 39 и 62 кэв, характерных для Sm¹⁴⁵, в спектре источника наблюдаются пики от γ -лучей различной энергии вплоть до 1500 кэв. Это излучение обусловлено наличием радиоактивных примесей (вероятно, Fe⁵⁵, Fe⁵⁹, Cu⁶⁴ и, возможно, Eu¹⁵² и Eu¹⁵⁴). Относительная интенсивность γ -линий источника из Sm¹⁴⁵ составляет 67; 5,4; 27,6% для энергии γ -квантов 39; 61; >61 (примеси) кэв соответственно.

Исследовались также источники из Se⁷⁵. Характеристики источников следующие:

	Se ⁷⁵ (необогащенный)	Se ⁷⁵ (обогащенный)
Активность (в момент проведения экспериментов)	1,5 г-экв Ra	0,23; 0,56; 0,82 г-экв Ra
Внешние размеры источника:		
диаметр	16,5 мм	7,5; 7,5; 7,5 мм
высота	16,5 мм	8,0; 8,0; 9,5 мм
Размеры активной части:		
диаметр	11,5 мм	5,0; 5,0; 4,5 мм
высота	11,5 мм	5,5; 5,5; 6,0 мм
Характеристика сырья	Селен металлический марки чистый, содержание Se ⁷⁴ —0,87%	Селен металлический, содержание Se ⁷⁴ —40,9%

Спектры обогащенного и необогащенного Se⁷⁵ исследовали на сцинтилляционном γ -спектрометре, состоящем из кристалла NaJ(Tl) высотой 10 мм и диаметром 29 мм, ФЭУ-11 и амплитудного анализатора. Разрешающая способность спектрометра составляла 11% на линии 660 кэв Cs¹³⁷.

Результаты измерения γ -спектров показали, что спектры обогащенных и необогащенных источников из Se⁷⁵ идентичны по форме и отличаются только интенсивностью излучения. Спектр источников из Se⁷⁵ в диапазоне энергий 60—1000 кэв показан на рис. 2. Видны пики от γ -квантов с энергиями примерно 75, 130 и 280 кэв, присутствуют также более жесткие γ -кванты малой интенсивности вплоть до 1000 кэв. Ярко выраженных пиков в этой области не наблюдается.



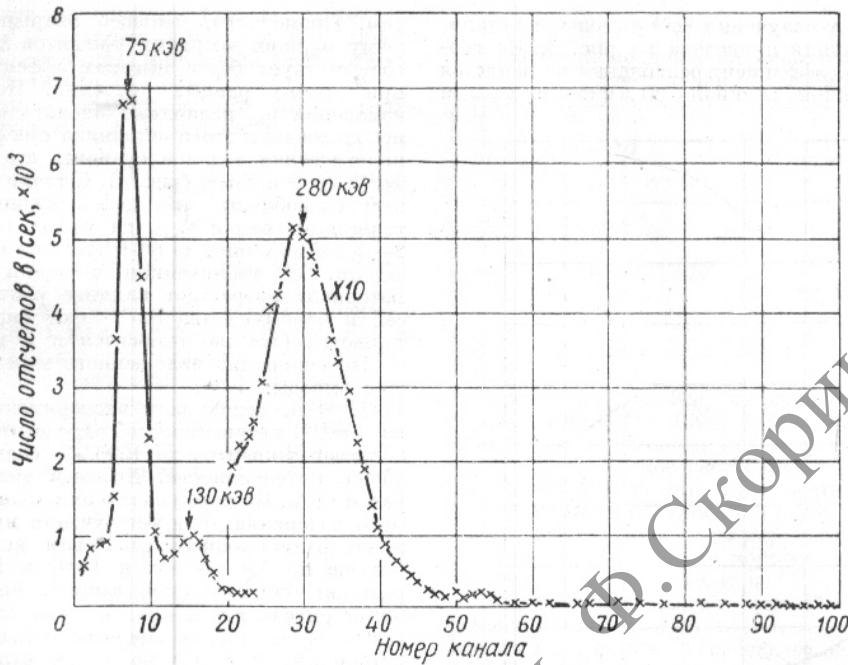


Рис. 2. Спектр излучения источника на Se^{75} (обогащенного) в диапазоне энергий 60—1000 кэВ.

Ниже приведена относительная интенсивность γ -линий Se^{75} , %:

Энергия γ -квантов, кэВ	Se^{75} (обогащенный)	Se^{75} (необогащенный)
65—95	56,5	56,5
120—140	12,5	12,8
240—280	21,0	20,7
> 280	10,0	10,0

Одна из основных характеристик источника излучения, определяющая эффективность использования его в приборах технологического контроля, — степень ослабления γ -излучения различными материалами. Ее можно характеризовать линейным коэффициентом ослабления γ -излучения.

Мощность физической дозы измерялась в условиях «широкого пучка». В качестве детектора использовался дозиметр «Киктус» с алюминиевой камерой объемом 1 л. Точность измерения составила $\pm 10\%$.

Расчет линейного коэффициента ослабления широкого пучка γ -лучей проводился по формуле

$$\mu_{\text{л.п.}} = - \frac{\ln \frac{P_d}{P_0}}{d},$$

где P_0 — мощность дозы γ -излучения в отсутствие поглотителя; P_d — мощность дозы γ -излучения за поглотителем толщиной d . Было обнаружено, что влияние излучения примесей с высокой энергией γ -квантов в спектре Sm^{145} начинает сказываться уже на толщинах стали 5—10 м.м. Непрерывная фильтрация мягких квантов приводит на толщине 30 м.м стали к эффективной энергии 1250 кэВ.

Линейные коэффициенты ослабления широкого пучка γ -излучения обогащенного и необогащенного Se^{75}

измерялись на различных толщинах стали, титана и дюралиюминия. Измерения показали, что результаты совпадают в пределах погрешности эксперимента. Это указывает на малое самопоглощение в источниках из Se^{75} и подтверждает идентичность радиационных характеристик источников из обогащенного и необогащенного Se^{75} .

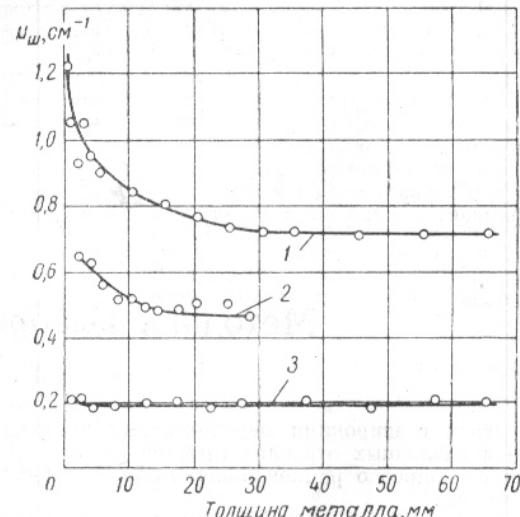


Рис. 3. Зависимость линейного коэффициента ослабления широкого пучка γ -излучения Se^{75} от толщины металла: 1 — сталь; 2 — титан; 3 — дюралиюминий.

Зависимость $\mu_{\text{ш}}\gamma$ -излучения Se^{75} от толщины стали, титана и дюралюминия приведена на рис. 3. Из графика следует, что коэффициент ослабления не меняется с увеличением толщины, начиная с 30 мм стали, и равен

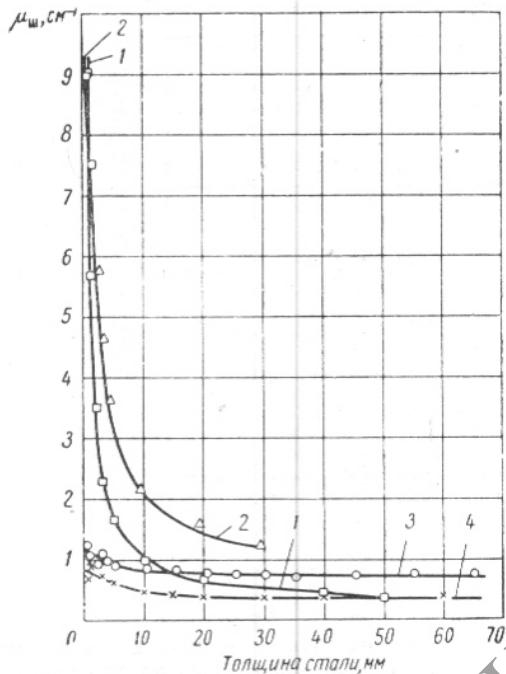


Рис. 4. Зависимость линейного коэффициента ослабления широкого пучка γ -излучения различных источников от толщины стали: 1 — Sm^{145} ; 2 — Tu^{170} ; 3 — Se^{175} ; 4 — Eu^{152} .

0,72 см⁻¹. Этому значению $\mu_{\text{ш}}$ соответствует эффективная энергия γ -излучения около 400 кэВ, что подтверждает данные спектральных исследований.

Известно, что точность технологического контроля с использованием радиоактивных изотопов определяется степенью ослабления излучения изотопов контролируемым материалом. В работе [1], в частности, показано, что минимальный выявляемый размер дефекта в материале обратно пропорционален линейному коэффициенту ослабления γ -излучения этим материа-

лом. Кроме того, меньшей энергией γ -квантов (большему $\mu_{\text{ш}}$ при энергиях γ -квантов $h\nu \leq 2000 \div 3000 \text{ кэВ}$) соответствует более высокая эффективность контроля при прочих равных условиях. Поэтому результаты измерений $\mu_{\text{ш}}$ позволяют оценить возможные области использования этого источника при решении ряда технологических задач и сравнить его с источниками из Tu^{170} , Se^{75} и Eu^{152} (рис. 4). С точки зрения разрешающей способности при дефектоскопическом контроле, толщинометрии и т. д. на малых толщинах стали (до 2—3 мм) источник из Sm^{145} должен иметь лучшие показатели. С увеличением толщины контролируемого материала возрастает влияние радиоактивных примесей и преимущества Sm^{145} как мягкого γ -излучателя теряются (это же относится и к вопросам защиты).

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:

1. В исследованном экспериментальном источнике из Sm^{145} интенсивность радиоактивных примесей с энергией γ -квантов до 1500 кэВ составляет более 27% общей интенсивности. Позитивный вклад этих примесей равен 60%. По мере увеличения толщины контролируемого материала для γ -излучения примесей возрастает и по радиационным свойствам источники из Sm^{145} больше приближаются к Tu^{170} и Se^{75} . В частности, размеры биологической защиты при работе с Sm^{145} будут определяться примесями в источнике. Поэтому, несмотря на низкую энергию основного γ -излучения, источники из Sm^{145} мало чем отличаются от более дешевых источников, например Tu^{170} и Se^{75} .

Чтобы сохранить преимущества Sm^{145} как источника мягкого γ -излучения, необходимо значительно уменьшить долю γ -излучения примесей в спектре источника.

2. По спектральному составу излучения источники из Se^{75} с обогащением исходного сырья Se^{74} до 41,0% не отличаются от серийно выпускаемых источников из природной смеси изотопов, содержащей 0,87% Se^{74} . Поэтому качественных изменений спектрального состава обогащение Se^{75} не вносит. Основное преимущество источников из обогащенного Se^{75} — их высокая удельная активность. Это позволяет повысить активность источников, увеличив тем самым производительность контроля.

Поступило в Редакцию 13/III 1963 г.

ЛИТЕРАТУРА

- С. В. Румянцев. Применение радиоактивных изотопов в дефектоскопии. М., Атомиздат, 1960.

УДК 621.039.84

Методика выбора изотопов для γ -реле

М. Л. Гольдин

В связи с широкими перспективами применения γ -реле в различных отраслях промышленности [1, 2] возникает вопрос о рациональном выборе источников γ -излучения.

Как показано в работе [3], активность источника излучения A (в мг-экв Ra) определяется по формуле

$$A = 3,4 \cdot 10^{-7} \frac{t/T_{1/2}}{q \epsilon S} J R^2 m \exp(-\mu d), \quad (1)$$

где t — время, в течение которого активность γ -излучателя обеспечивает такой поток γ -квантов при облучении детектора, когда наблюдается надежное срабатывание контактов выходного реле (время до замены источника излучения); $T_{1/2}$ — период полураспада; J — оптимальная величина скорости счета детектора, исключающая ложные срабатывания γ -реле; R — расстояние между источником излучения и приемником; m — γ -эквивалент изотопа (без начального фильтра);